

**Сведения о ведущей организации**

по кандидатской диссертации В.М.Ханина «Сцинтилляционные процессы в активированных церием керамиках со структурой граната», по специальности 01.04.07 – Физика конденсированного состояния

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский университет или СПбГУ
Ведомственная принадлежность	Правительство Российской Федерации
Почтовый индекс, адрес организации	199034, Санкт-Петербург, Университетская наб. д.7/9
Адрес официального сайта в сети «Интернет»	www.spbu.ru
Телефон	+7 (812) 328-97-01
Адрес электронной почты	spbu@spbu.ru
Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет	<p>1.Е. О. Filatova, A. S. Konashuk, S. S. Sakhonenkov, A. A. Sokolov &amp; V. V. Afanas'ev "Re-distribution of oxygen at the interface between <math>\gamma</math>-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and TiN"// Sci. Rep. – 2017. – 7. – p. 4541.</p> <p>2.A.S. Konashuk, E.O. Filatova. "Redistribution of valence and conduction band states depending on ways of modification of SiO<sub>2</sub> structure" // Phys. Chem. Chem. Phys. – 2017. – 19 – p. 26201-26209.</p> <p>3.A. Konashuk, E. Filatova, S. Sakhonenkov, V. Afanas'ev "Effect of deposition technique on chemical bonding and amount of porogen residues in organosilicate glass" // Microelectron. Eng. – 2017. – 178. – p. 209-212.</p> <p>4.Elena O. Filatova, Yulia V. Egorova, Kristina A. Galdina, Tobias Scherb, Gerhard Schumacher, Henny J.M. Bouwmeester, Stefan Baumann. "Effect of Fe content on atomic and electronic structure of complex oxides Sr(Ti,Fe)O<sub>3-<math>\delta</math></sub>"// Solid State Ionics. – 2017.- 308 – p. 27-33</p> <p>5.Aleksandr O. Kondrakov, Holger Geßwein,</p>

Kristina Galdina, Lea de Biasi, Velimir Meded, Elena O. Filatova, Gerhard Schumacher, Wolfgang Wenzel, Pascal Hartmann, Torsten Brezesinski, and Jürgen Janek, "Charge-Transfer-Induced Lattice Collapse in Ni-Rich NCM Cathode Materials during Delithiation" // J. Phys. Chem. C - 2017- 121 – p.24381-24388

6. Elena O. Filatova, Aleksei S. Konashuk, Franz Schaefers, and Valeri V. Afanas'ev "Metallization-induced oxygen deficiency of  $\gamma$ - $\text{Al}_2\text{O}_3$  layers" // J. Phys. Chem. C. – 2016. – 120. – p. 8979–8985.

7. A. P. Baraban, V. A. Dmitriev, V. E. Drozd, V. A. Prokofiev, S. N. Samarin, and E. O. Filatova. "Interface properties of Si-SiO<sub>2</sub>-Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> structure by cathodoluminescence Spectroscopy" // JOURNAL OF APPLIED PHYSICS – 2016 -119 – p. 055307

8. Elena Filatova, Aleksei Konashuk, Yuri Petrov, Evgeny Ubyivovk, Andrey Sokolov, Andrei Selivanov & Victor Drozd. "NEXAFS study of electronic and atomic structure of active layer in Al/indium tin oxide/TiO<sub>2</sub> stack during resistive switching" // Science and Technology of Advanced Materials- 2016 -VOL . 17- NO . 1-p. 274–284

9. Filatova, E.O., A.S. Konashuk "Interpretation of the changing the band gap of  $\text{Al}_2\text{O}_3$  depending on its crystalline form: connection with different local symmetries" / E.O. Filatova, // J. Phys. Chem. C. – 2015. – 119. – p. 20755–20761.

10. Y.V. Egorova, T. Scherb, G. Schumacher, H.J.M. Bouwmeester, E.O. Filatova. "Soft X-ray absorption spectroscopy study of  $(\text{Ba}_{0.5}\text{Sr}_{0.5})(\text{Co}_{0.8}\text{Fe}_{0.2})_{1-x}\text{Nb}_x\text{O}_{3-5}$  with different content of Nb (5%-20%)" // Journal of Alloys and Compounds -2015-650 – p. 848-852

11. E O Filatova, A P Baraban, A S Konashuk, M A Konyushenko, A A Selivanov, A A Sokolov, F Schaefers and V E Drozd. "Transparent-conductive-oxide (TCO) buffer layer effect on the resistive switching process in metal/TiO<sub>2</sub>/TCO/metal assemblies" // New Journal of Physics -2014-16 – p. 113014-15

12. E. O. Filatova I.V. Kozhevnikov, A.A.

		<p>Sokolov, «Characterization of High-k Dielectrics Internal Structure by X-Ray Spectroscopy and Reflectometry. New Approaches to Inter Layer Identification and Analysis», Chapter 7 in “High-k Gate Dielectrics for CMOS Technology”, Gang He and Zhaoqi Sun, Eds., Wiley-VCH Verlag. Weinheim, Germany, 2012, pp. 225-271.</p> <p>13. “X-ray Optics and Inner-Shell Electronics of Hexagonal BN” eds. Elena O. Filatova, Andrey A. Pavlychev, Nova Science Publishers, Inc., New York, 2011 p.107</p>
--	--	--

Верно

И.о. директора Центра экспертиз



В.А. Семенов